

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2025년 4월 24일 (24.04.2025)



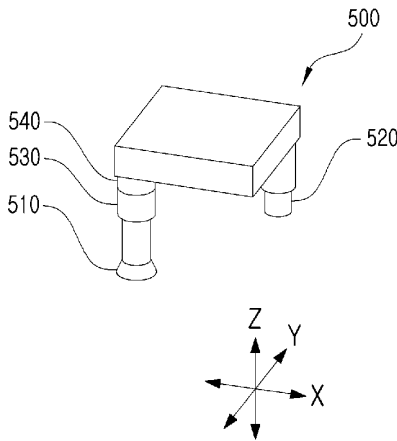
(10) 국제공개번호
WO 2025/084815 A1

- (51) 국제특허분류:
G01R 31/28 (2006.01) *H04N 7/18* (2006.01)
G06T 7/00 (2006.01) *H01L 21/683* (2006.01)
G06T 7/70 (2017.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2024/015804
- (22) 국제출원일: 2024년 10월 17일 (17.10.2024)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2023-0140575 2023년 10월 19일 (19.10.2023) KR
10-2023-0140845 2023년 10월 20일 (20.10.2023) KR
10-2023-0142139 2023년 10월 23일 (23.10.2023) KR
10-2023-0153765 2023년 11월 8일 (08.11.2023) KR
10-2024-0015568 2024년 2월 1일 (01.02.2024) KR
10-2024-0099462 2024년 7월 26일 (26.07.2024) KR
- (71) 출원인: 주식회사 테크윙 (TECHWING, INC.) [KR/KR]; 18487 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37 (KR).
- (72) 발명자: 나윤성 (NA, Yun Sung); 31068 충청남도 천안시 동남구 향교1길 114-7 (KR). 이석호 (LEE, Suk Ho); 18440 경기도 화성시 금반2길 18-4, 202호 (KR). 김동일 (KIM, Dong Il); 31406 충청남도 아산시 둔포면

- 아산밸리남로 81, 805동 1405호 (KR). 주재중 (JU, Jae-jong); 18024 경기도 평택시 고덕국제6로 16, 1508동 701호 (KR). 남경표 (NAM, Kyung-Pyo); 18148 경기도 오산시 부산중앙로 11, 107동 1301호 (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 빛과소금 (LIGHT AND SALT PATENT AND LAW FIRM); 08506 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 1-312호 (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT TEST HANDLER AND ELECTRONIC COMPONENT REARRANGEMENT METHOD OF ELECTRONIC COMPONENT TEST HANDLER

(54) 발명의 명칭: 전자부품 테스트용 핸들러 및 전자부품 테스트용 핸들러의 전자부품 재배치방법



(57) Abstract: The present invention relates to an electronic component test handler. According to the present invention, the electronic component test handler comprises: a test table on which electronic components are loaded; and a rearrangement mechanism for rearranging the electronic components, loaded on temporary sections of the test table, to the correct sections. The rearrangement mechanism includes: a rearrangement picker that can grip electronic components; a rearrangement camera that is spaced apart from the rearrangement picker; and an elevator that raises and lowers the rearrangement picker to allow the rearrangement picker to grip electronic components that are on the test table or place electronic components onto the test table. When the present invention is implemented, the reliability of the connection between electronic components and a tester can be improved while precisely rearranging the electronic components during a process of rearranging the electronic components.

(57) 요약서: 본 발명은 전자부품 테스트용 핸들러에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 전자부품들이 적재되는 테스트테이블; 및 상기 테스트테이블의 임시구역들에 적재된 전자부품들을 정위치구역들로 재배치시키기 위한 재배치기구; 를 가지며, 상기 재배치기구는 전자부품을 파지할 수 있는 재배치픽커; 상기 재배치픽커와 이격되게 배치되는 재배치카메라; 및 상기 재배치픽커를 승강시켜서 상기 재배치픽커가 상기 테스트테이블에 있는 전자부품을 파지하거나 상기 테스트테이블로 전자부품을 안착시킬 수 있도록 하는 승강기; 를 포함한다. 본 발명이 적용되면 전자부품의 재배치 과정에서 전자부품의 재배치가 정교하게 이루어지면서도 전자부품과 테스터 간의 연결에 대한 신뢰성이 향상될 수 있다.

[다음 쪽 계속]

ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))